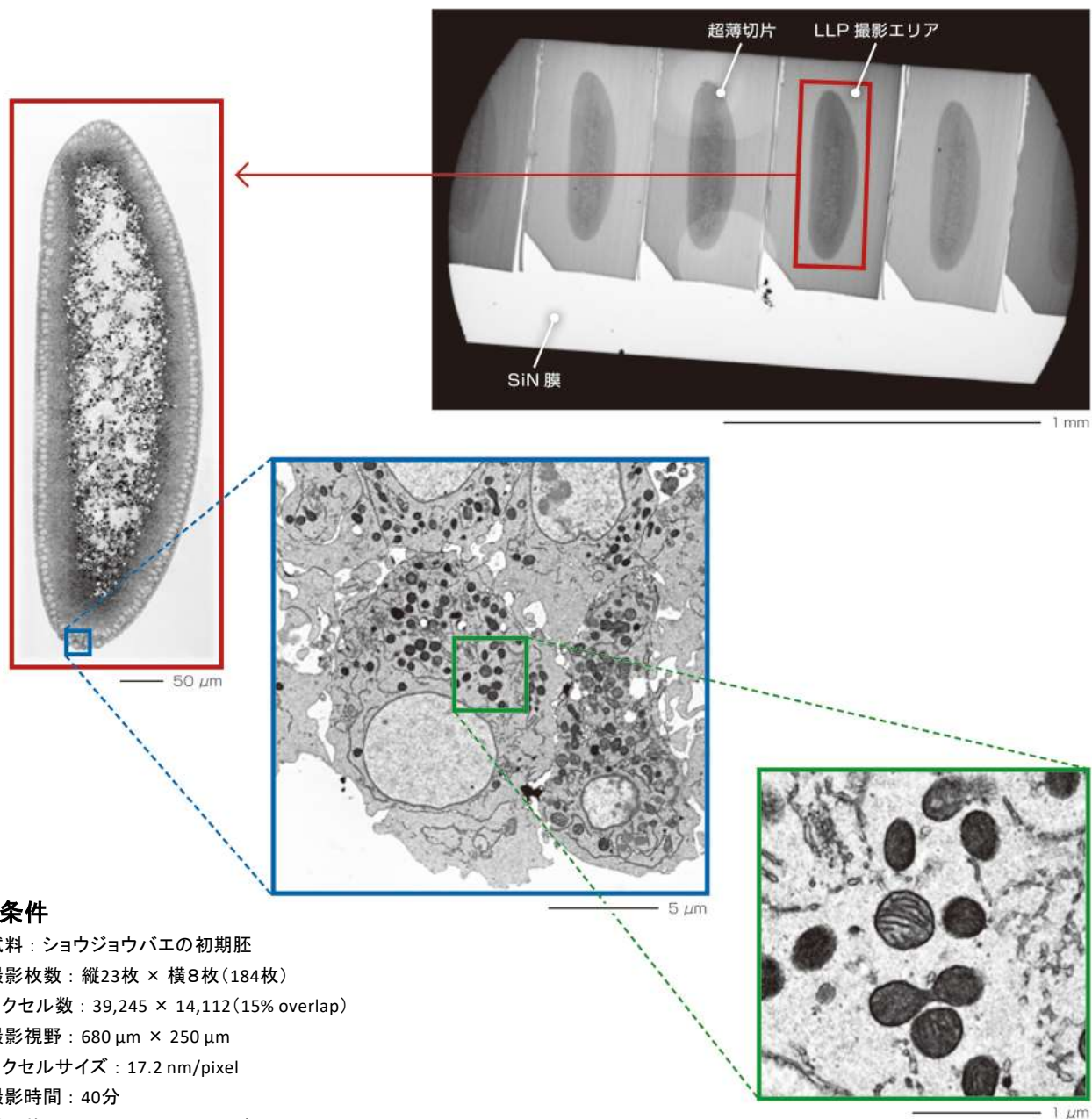


SiN Window Chipを用いた広域観察

関連製品: 透過電子顕微鏡(TEM)

自動モニターシステム「Limitless Panorama (LLP)」機能を使って、超広域高精細・画像(ピクセル数: 約5億5千万、ピクセルサイズ: 約17 nm)を取得しました。SiN Window ChipとLLPを組み合わせ、細胞小器官を観察できる分解能を維持しつつ、胚全体を観察できる広視野を撮影できます。



撮影条件

- 試料: ショウジョウバエの初期胚
- 撮影枚数: 縦23枚 × 横8枚(184枚)
- ピクセル数: 39,245 × 14,112(15% overlap)
- 撮影視野: 680 μm × 250 μm
- ピクセルサイズ: 17.2 nm/pixel
- 撮影時間: 40分
- 撮影装置: JEM-1400Flash (加速電圧: 120 kV)

【参考文献】

Y. Konyuba et al., *Microscopy* 67 (2018) 367-370.

Copyright © 2020 JEOL Ltd.

このカタログに掲載した商品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせ下さい。

